



## 반도체 제조업체들의 경쟁력은 up 불량률은 down

### 특허등록번호

10-1360906

### 특허명

고분해능 X-선 로킹 커브 측정을 이용한 단결정 웨이퍼의 면방위 측정 방법

### 대표발명자

신기능재료표준센터 김창수



### 단결정 웨이퍼의 면방위 측정 기술

웨이퍼는 반도체의 품질과 직결되는 중요한 역할을 하는데요, 이러한 웨이퍼의 측정을 기존의 방식보다 무려 10배 이상 더 정확하게 해주는 기술이 있습니다.

KRISS는 LED 기판 제조업체와 반도체 제조업체에 '단결정 웨이퍼의 면방위 측정 방법'을 제공해 제품의 질 향상에 도움을 주고 있습니다.

(주)프라우텍의 대표는 "측정전문기관인 KRISS로부터 면방위 측정값을 교정 받은 덕분에 품질을 높여 진입장벽이 높은 일본 시장에 진출할 수 있었고, 현재 지속적으로 주문량이 증가하고 있다"고 전하기도 했는데요.

KRISS는 반도체산업 기술 외에도 다양한 산업분야의 기술을 다량 보유하고 있습니다. 기술이 필요한 곳에 꼭 맞는 기술을 전하는 KRISS 기술이진센터와 협력하여 여러분의 산업체의 경쟁력을 더욱 높여보세요!

